工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

請購說明

1. 品名：元件結構分析檢測
2. 目的：因應感測器製程測試需求，委託廠商分析
3. 預計驗收時間：2026/12/10
4. 規格說明：

SN	Service Items	Unit	Qty
01	FIB-FA(高) 一般件	hr	20
02	SEM/EDX 一般件	hr	22
03	I-V curve 量測 一般件	hr	10
04	COB Bonding 金線 51~100 pitch≧85um 一般件	ea	10
05	COB Bonding 金線 20~50 pitch≧85um 一般件	ea	15
06	COB Bonding 金線 1~19 pitch≧85um 一般件	ea	18
07	HTS 高溫貯存試驗 基本費	set	11
08	HTS 高溫貯存試驗 0~ 300c	hr	28
09	Engineering Charge 工程費用	hr	10
10	超高解析3D光學顯微鏡 一般件	hr	10

Copyright 2024 ITRI 工業技術研究院